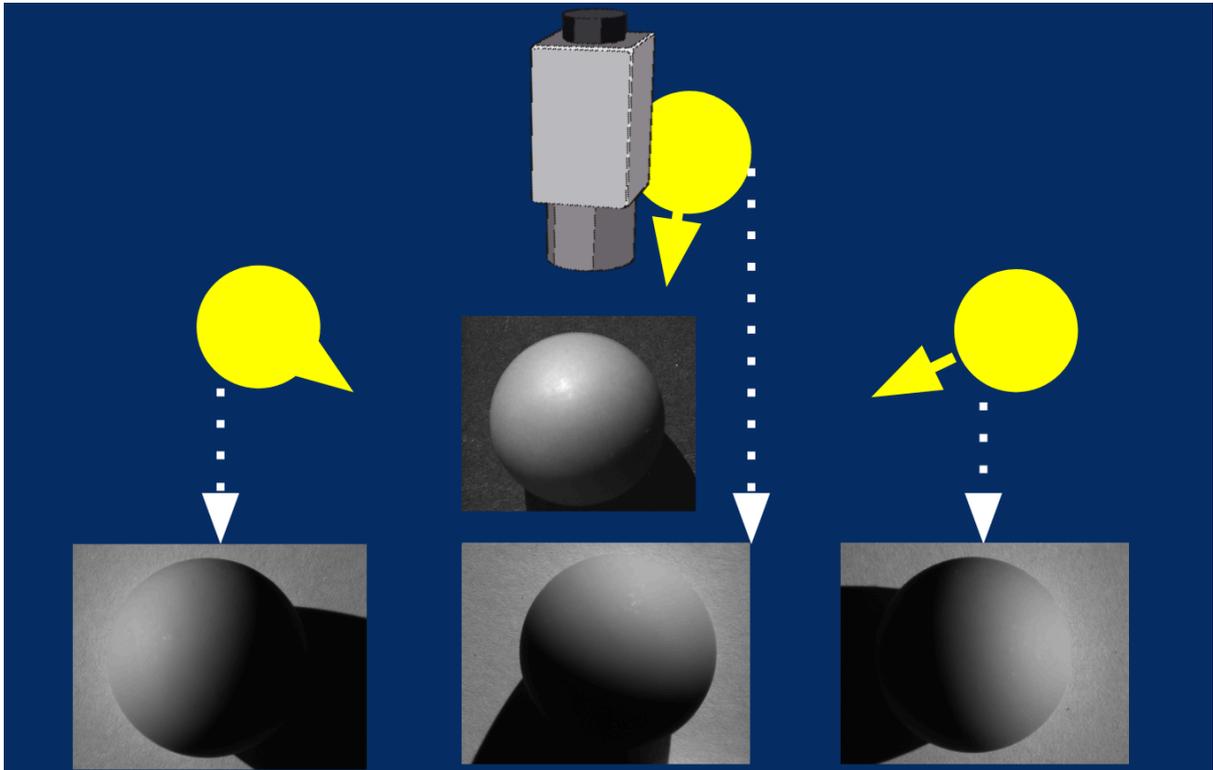


標籤凹凸分析

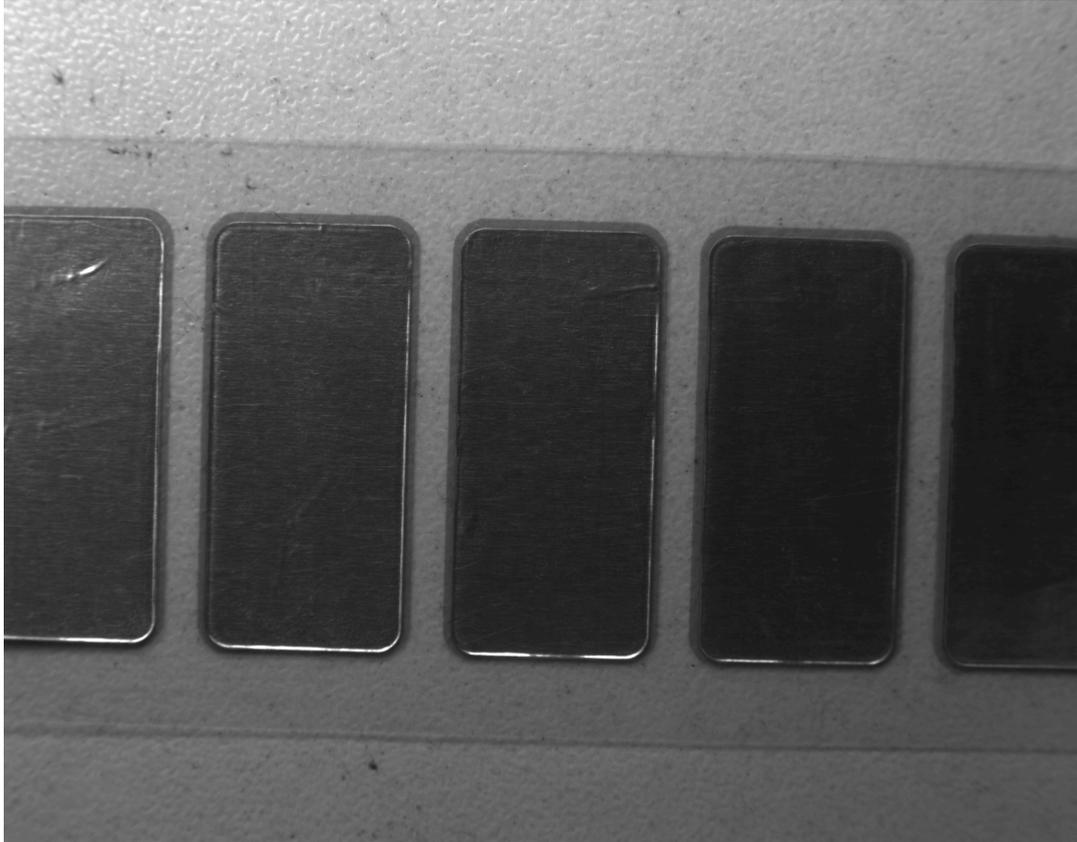
使用的光學技術為：**Photometric stereo**

從不同角度光源下的影像得到影像的高度資訊。

解決：待測工件本身反光，凹凸處有方向形，無法用一個光源將瑕疵處呈現出來。



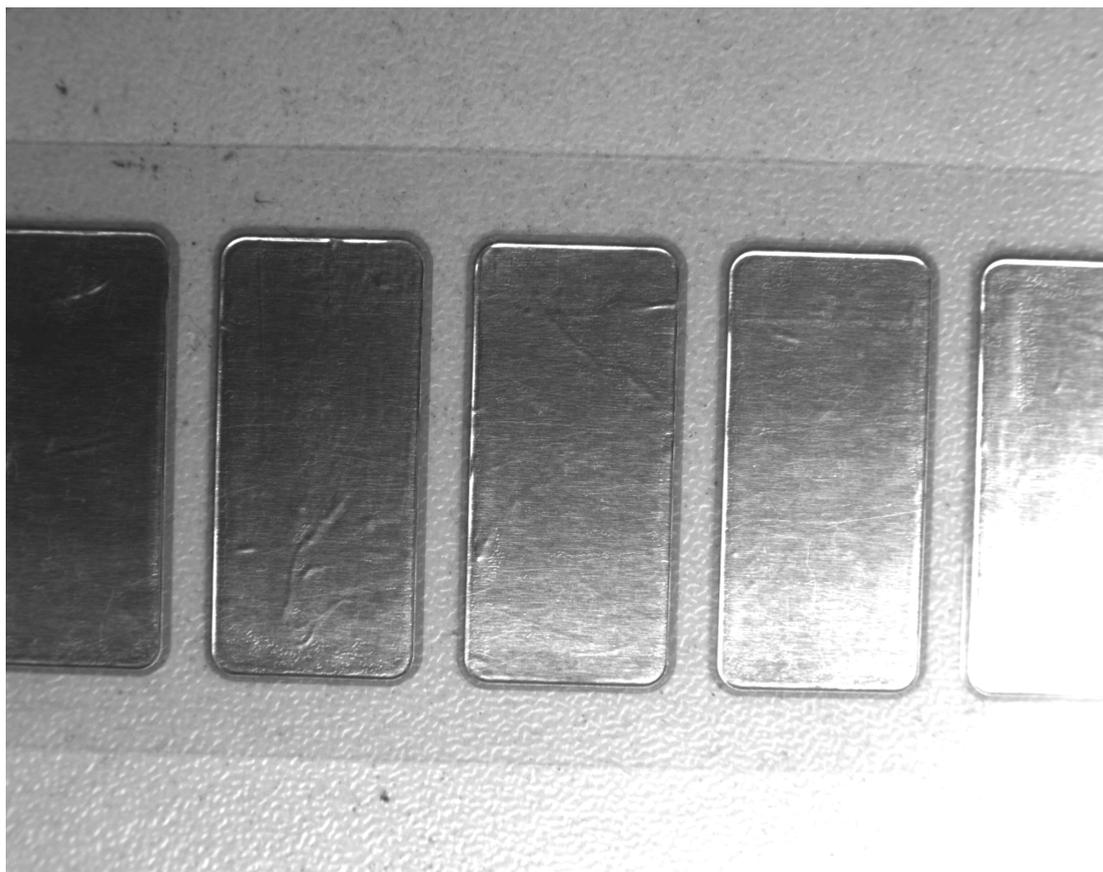
光學實驗：
光源角度一：



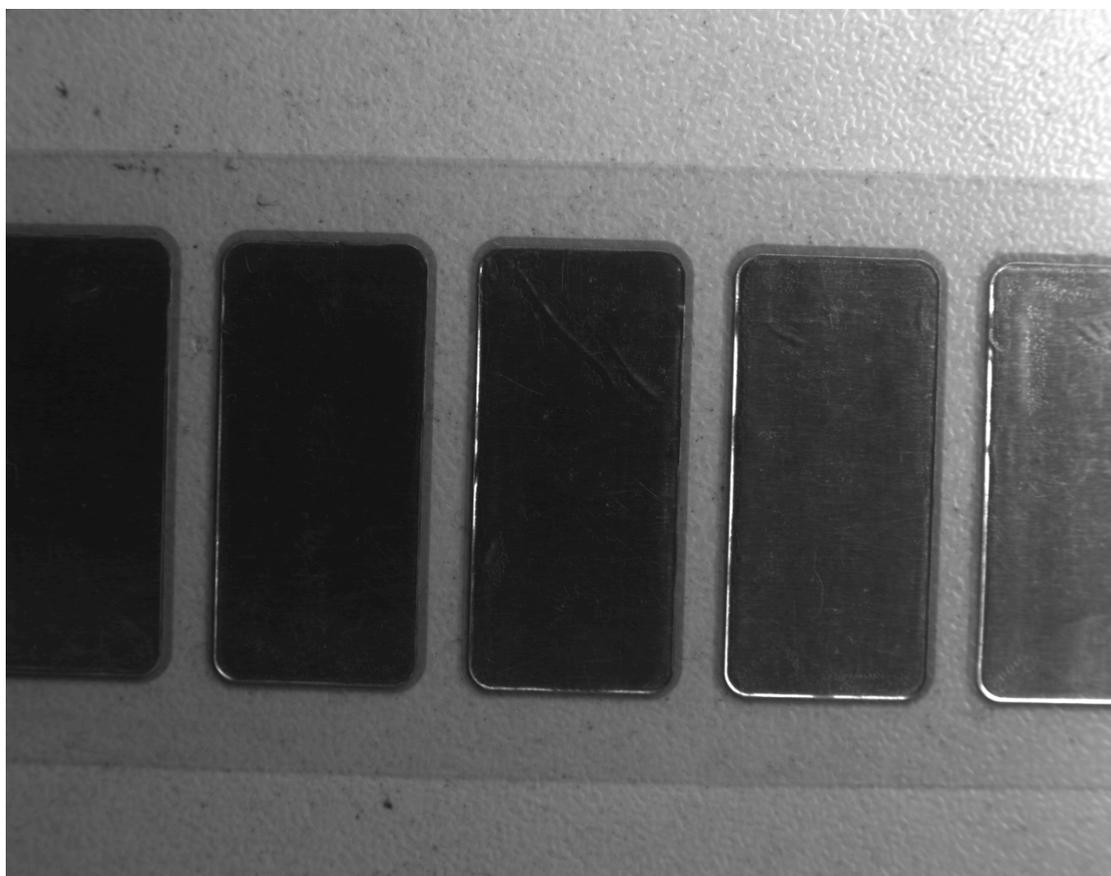
光源角度二：



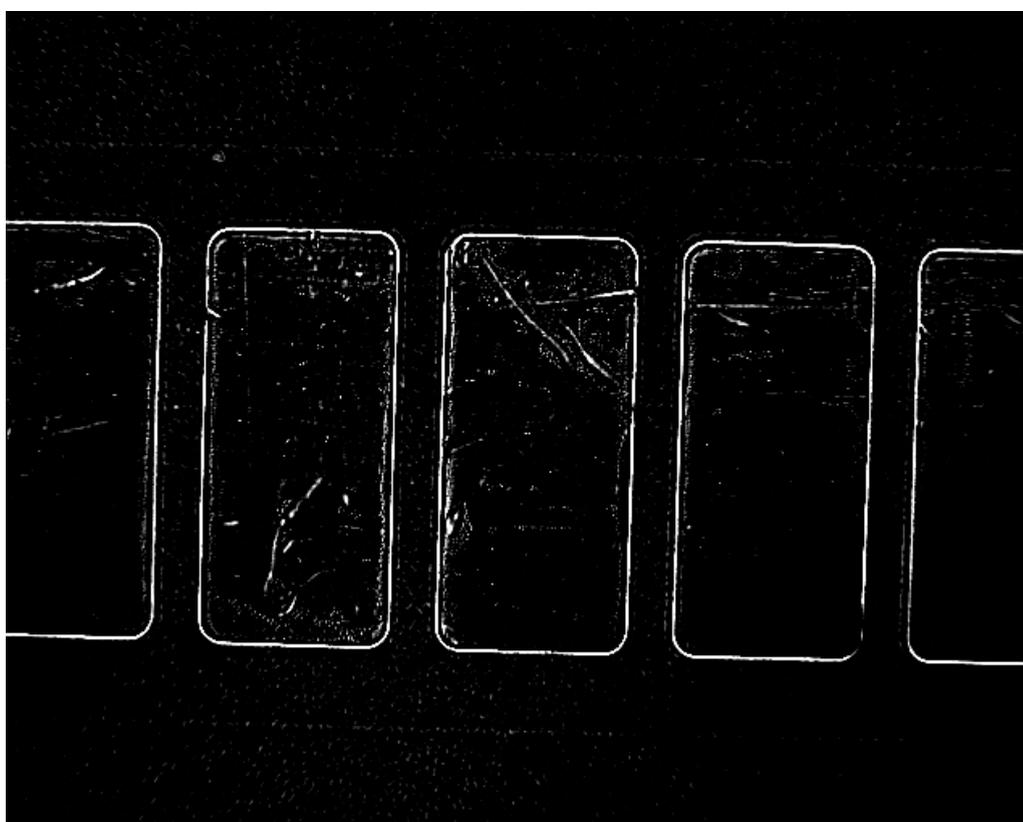
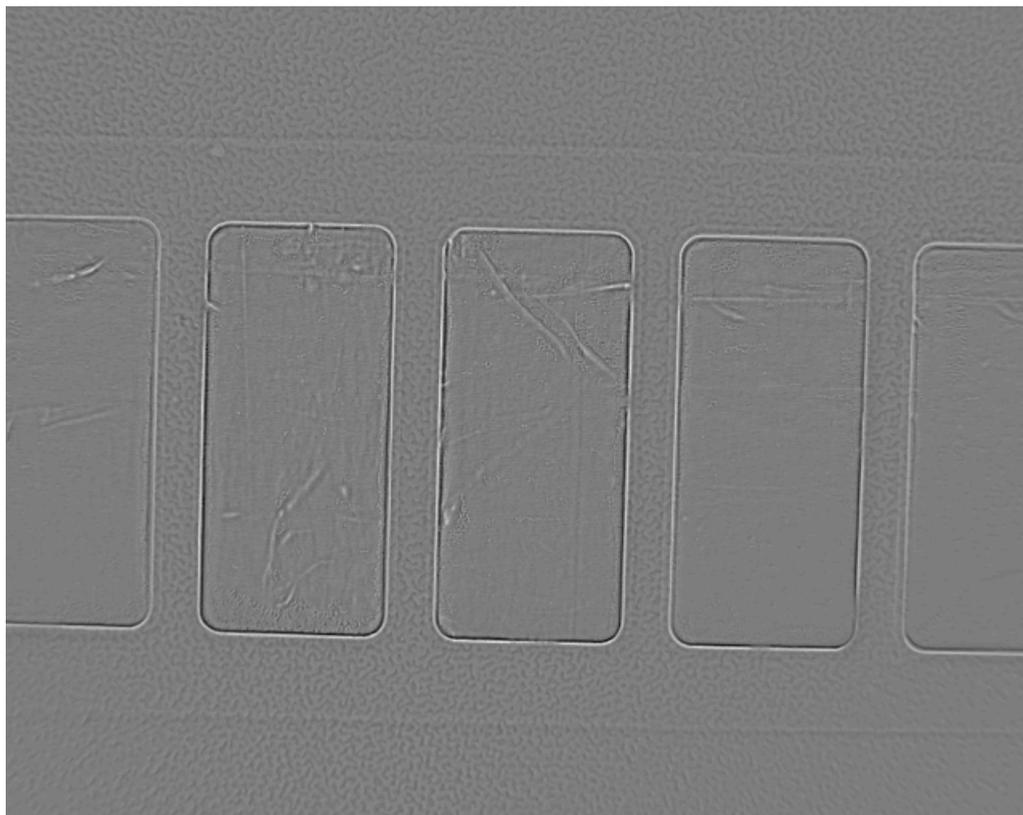
光源角度三：



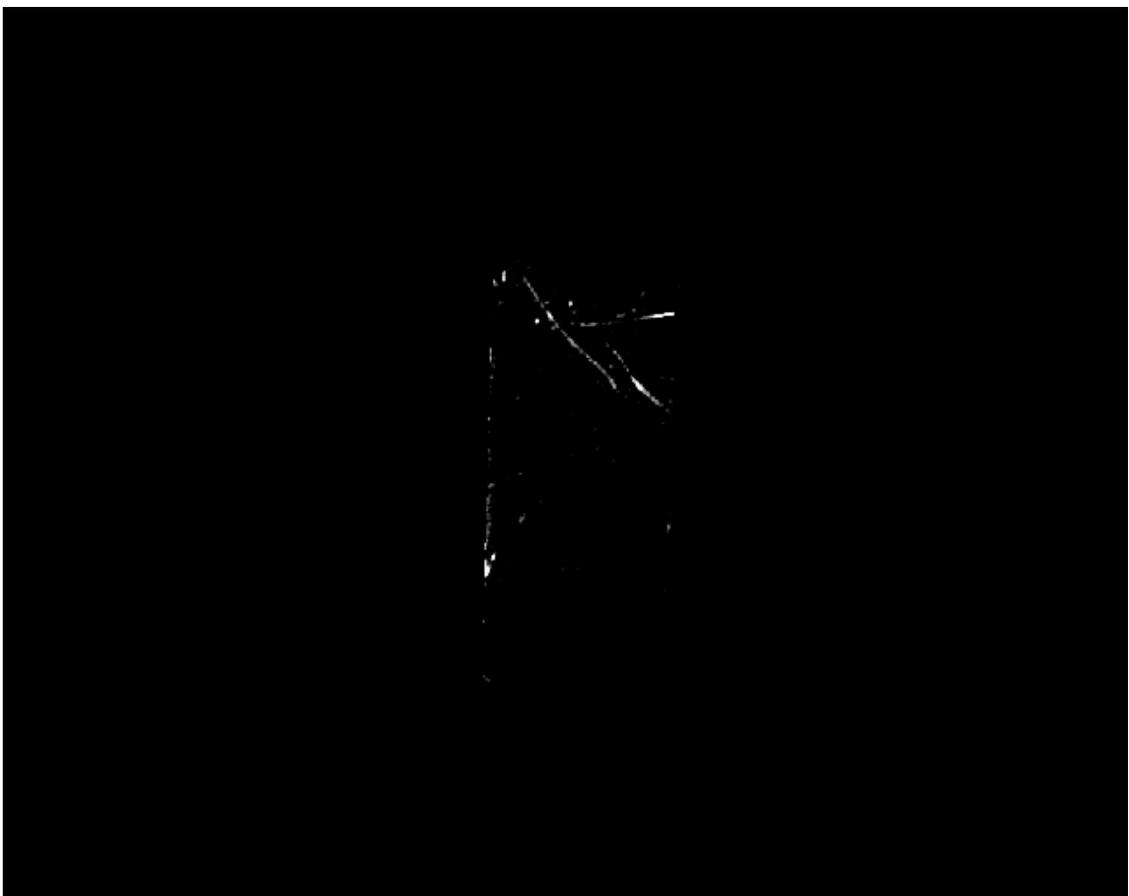
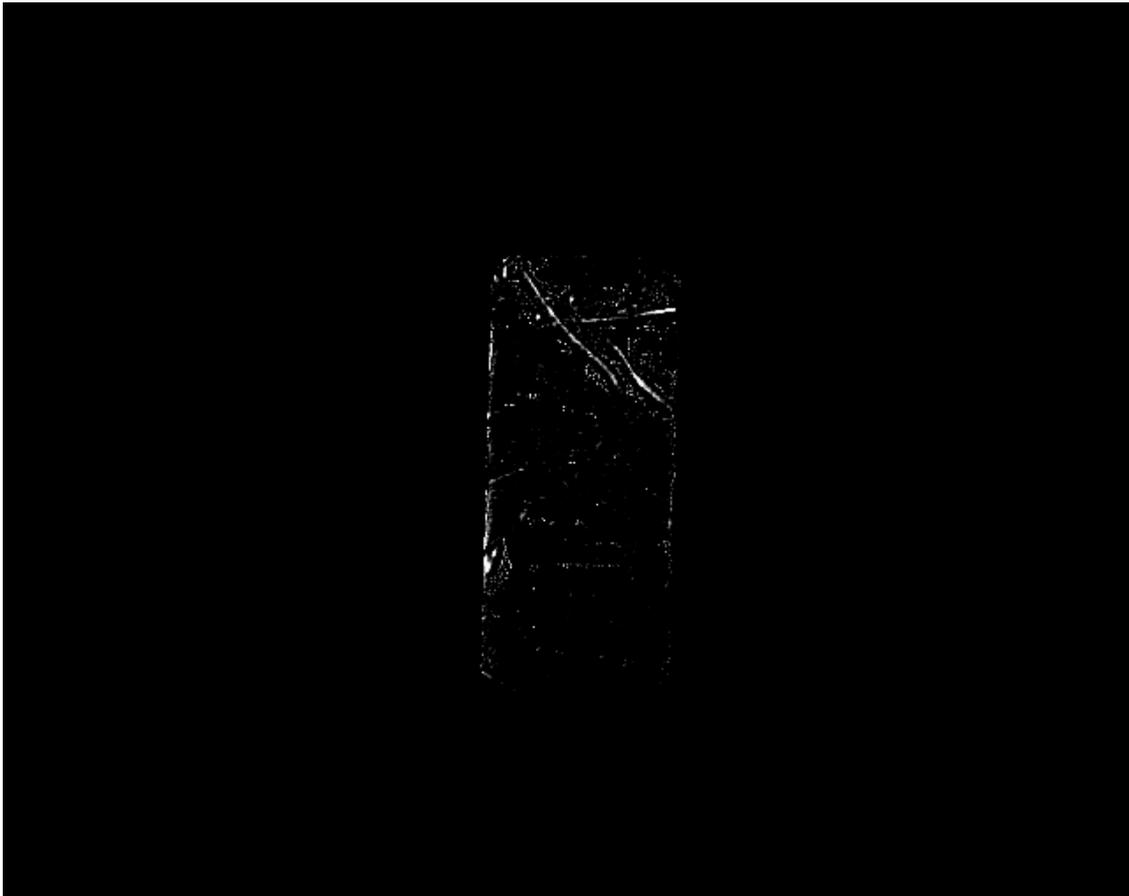
光源角度四：



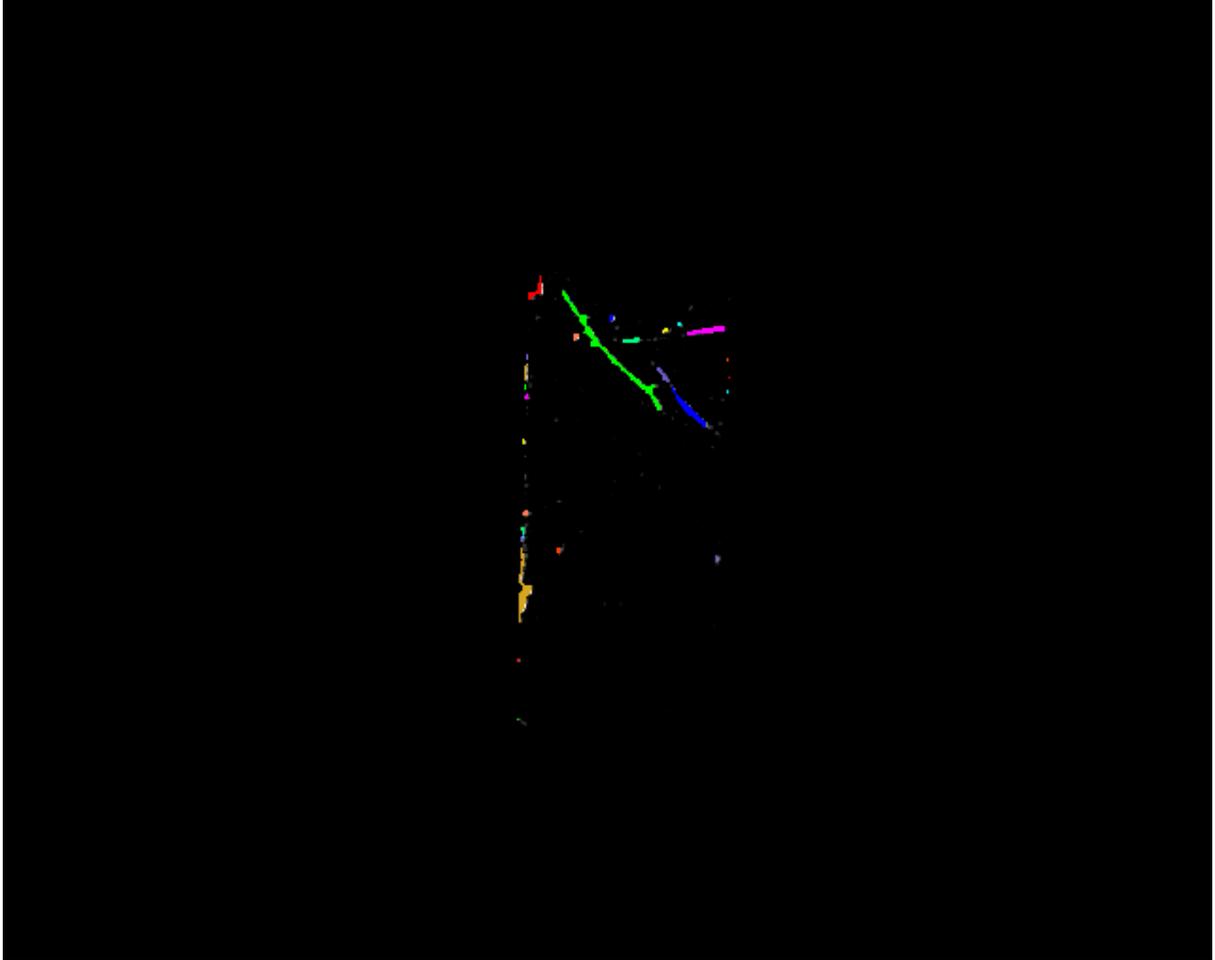
影像的高度資訊結果：



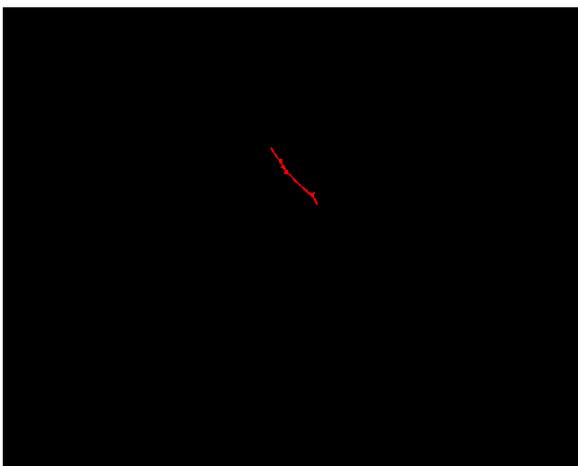
影像的後處理：



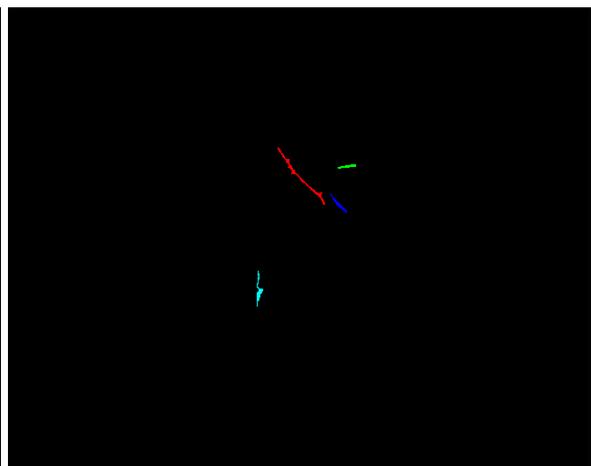
影像門檻值設定：



可以設定上面不同顏色區塊，多少面積以上的才算不良區域。



左圖：面積1000以上



右圖：面積500以上